

化学分析：目次

用 語

JIS K 0147-1 : 2017	表面化学分析—用語—第1部：一般用語及び分光法に関する用語……	ISO 18115-1 : 2013 (IDT) …	15
JIS K 0147-2 : 2017	表面化学分析—用語—第2部：走査型プローブ顕微鏡に関する用語……	ISO 18115-2 : 2013 (IDT) …	132
JIS K 0211 : 2013	分析化学用語(基礎部門) ……		192
JIS K 0212 : 2016	分析化学用語(光学部門) ……		250
JIS K 0213 : 2014	分析化学用語(電気化学部門) ……		309
JIS K 0214 : 2013	分析化学用語(クロマトグラフィー部門) ……		357
JIS K 0215 : 2016	分析化学用語(分析機器部門) ……		420
JIS K 0216 : 2014	分析化学用語(環境部門) ……		517
JIS Z 8144 : 2004	官能評価分析—用語 ……	ISO 5492 : 1992 (MOD) …	583
JIS Z 8462-1 : 2001	測定方法の検出能力—第1部：用語及び定義 ……	ISO 11843-1 : 1997 (IDT) …	598

標準物質

JIS B 9624 : 2007	印刷技術及び写真技術—反射及び透過測定用認証標準物質(CRM)の保証に必要な付随文書及び使用手順、並びに反射及び透過測定システムの合成標準不確かさの求め方 ……	ISO 15790 : 2004 (IDT) …	607
JIS K 8005 : 2014	容量分析用標準物質 ……		623
JIS K 8005 : 2016	(追補1) ……		796
JIS Q 0030 : 2019	標準物質—選択された用語及び定義(解説収録) ……	ISO Guide 30 : 2015 (IDT) …	835
JIS Q 0031 : 2018	標準物質—認証書、ラベル及び附属文書の内容(解説収録) ……	ISO Guide 31 : 2015 (IDT) …	846
JIS Q 0033 : 2019	標準物質—標準物質の適正な使い方(解説収録) ……	ISO Guide 33 : 2015 (IDT) …	858
◇ JIS Q 0035 : 2008	標準物質—認証のための一般的及び統計的な原則(解説収録) ……	ISO Guide 35 : 2006 (IDT) …	891
JIS Q 17034 : 2018	標準物質生産者の能力に関する一般要求事項(解説収録) ……	ISO 17034 : 2016 (IDT) …	948
JIS Z 8461 : 2001	標準物質を用いた校正(検量線が直線の場合) ……	ISO 11095 : 1996 (IDT) …	974

通則・分析方法

	JIS K 0050 : 2019	化学分析方法通則	999
	JIS K 0055 : 2002	ガス分析装置校正方法通則	1035
	JIS K 0111 : 1983	ポーラログラフ分析のための通則	1042
	JIS K 0113 : 2005	電位差・電流・電量・カールフィッシャー滴定方法通則	1061
		ISO 760 : 1978 (MOD)	1061
	JIS K 0114 : 2012	ガスクロマトグラフィー通則	1077
㊦	JIS K 0115 : 2020	吸光光度分析通則	1105
	JIS K 0116 : 2014	発光分光分析通則	1133
	JIS K 0117 : 2017	赤外分光分析通則	1160
	JIS K 0119 : 2008	蛍光X線分析通則	1187
	JIS K 0120 : 2005	蛍光光度分析通則	1202
	JIS K 0121 : 2006	原子吸光分析通則	1214
	JIS K 0122 : 1997	イオン電極測定方法通則	1232
	JIS K 0123 : 2018	ガスクロマトグラフィー質量分析通則	1248
	JIS K 0124 : 2011	高速液体クロマトグラフィー通則	1303
	JIS K 0126 : 2019	流れ分析通則	1340
	JIS K 0127 : 2013	イオンクロマトグラフィー通則	1369
	JIS K 0129 : 2005	熱分析通則	1391
	JIS K 0130 : 2008	電気伝導率測定方法通則	1403
	JIS K 0131 : 1996	X線回折分析通則	1411
	JIS K 0132 : 1997	走査電子顕微鏡試験方法通則	1424
◇	JIS K 0133 : 2007	高周波プラズマ質量分析通則	1437
	JIS K 0134 : 2002	近赤外分光分析通則	1472
	JIS K 0135 : 2003	分取液体クロマトグラフィー通則	1481
	JIS K 0136 : 2015	高速液体クロマトグラフィー質量分析通則	1490
	JIS K 0137 : 2010	ラマン分光分析通則	1515
	JIS K 0138 : 2018	定量核磁気共鳴分光法通則 (qNMR 通則) (解説収録)	1528
	JIS K 0144 : 2018	表面化学分析—グロー放電発光分光分析方法通則	1580
		ISO 14707 : 2015 (IDT)	1580
	JIS K 0145 : 2002	表面化学分析—X線光電子分光装置—エネルギー軸目盛の校正	1590
		ISO 15472 : 2001 (IDT)	1590
	JIS K 0146 : 2002	表面化学分析—スパッター深さ方向分析—層構造系標準物質を用いた最適化法	1610
		ISO 14606 : 2000 (IDT)	1610
	JIS K 0149-1 : 2019	マイクロビーム分析—走査電子顕微法—第1部：像倍率校正方法	1620
		ISO 16700 : 2016 (IDT)	1620
㊦	JIS K 0150 : 2020	表面化学分析—亜鉛及び／又はアルミニウム基金属めっきのグロー放電発光分光分析方法	1636
		ISO 16962 : 2017 (IDT)	1636

JIS K 0152 : 2014	表面化学分析—X線光電子分光法—強度目盛の繰返し性、再現性及び 一定性……………ISO 24237 : 2005 (IDT) … 1673
JIS K 0153 : 2015	表面化学分析—二次イオン質量分析法—スタティック二次イオン質量分 析法における相対イオン強度目盛の繰返し性、再現性及び一定性の確認 方法……………ISO 23830 : 2008 (IDT) … 1688
JIS K 0154 : 2017	表面化学分析—分析試料の準備及び取付けに関する指針…………… ……………ISO 18116 : 2005 (IDT) … 1700
JIS K 0155 : 2018	表面化学分析—二次イオン質量分析法—単一イオン計数飛行時間形質量 分析器における強度軸の線形性……………ISO 17862 : 2013 (MOD) … 1716
JIS K 0156 : 2018	表面化学分析—二次イオン質量分析法—デルタ多層標準物質を用いたシリ コンの深さ校正方法……………ISO 23812 : 2009 (IDT) … 1743
JIS K 0160 : 2009	表面化学分析—シリコンウェーハ表面からの金属の化学的回収方法及び 全反射蛍光X線(TXRF)分析法による定量方法…………… ……………ISO 17331 : 2004 (IDT) … 1761
JIS K 0161 : 2010	表面化学分析—オージェ電子分光法—装置性能を示す主要な項目の記 載方法……………ISO 15471 : 2004 (MOD) … 1773
JIS K 0162 : 2010	表面化学分析—X線光電子分光法—装置性能を示す主要な項目の記載 方法……………ISO 15470 : 2004 (MOD) … 1780
JIS K 0163 : 2010	表面化学分析—二次イオン質量分析法—イオン注入標準物質を用いた相 対感度係数の決定方法……………ISO 18114 : 2003 (IDT) … 1787
JIS K 0164 : 2010	表面化学分析—二次イオン質量分析法—シリコン内のボロンの深さ方向 分布測定方法……………ISO 17560 : 2002 (MOD) … 1790
JIS K 0165 : 2011	表面化学分析—汎用オージェ電子分光器による元素分析のためのエネル ギー軸の校正方法……………ISO 17973 : 2002 (MOD) … 1797
JIS K 0166 : 2011	表面化学分析—高エネルギー分解能をもつオージェ電子分光器による元 素分析及び化学結合状態分析のためのエネルギー軸の校正方法…………… ……………ISO 17974 : 2002 (MOD) … 1807
JIS K 0167 : 2011	表面化学分析—オージェ電子分光法及びX線光電子分光法—均質物質 定量分析のための実験的に求められた相対感度係数の使用指針…………… ……………ISO 18118 : 2004 (IDT) … 1830
JIS K 0168 : 2011	表面化学分析—スタティック二次イオン質量分析法の情報フォーマット … ……………ISO 22048 : 2004 (IDT) … 1847
JIS K 0169 : 2012	表面化学分析—二次イオン質量分析法—デルタ多層標準物質を用いた深 さ分解能パラメータ評価方法……………ISO 20341 : 2003 (IDT) … 1853
JIS K 0189 : 2013	マイクロビーム分析—電子プローブマイクロ分析—波長分散X線分光法の パラメータの決定方法……………ISO 14594 : 2003 (MOD) … 1857
JIS K 0190 : 2010	マイクロビーム分析—電子プローブマイクロ分析—波長分散X線分光法に よる点分析における定性分析のための指針 ……ISO 17470 : 2004 (MOD) … 1873
JIS K 3812 : 2003	電気泳動分析通則……………1881
JIS K 3813 : 2003	キャピラリー電気泳動分析通則……………1887

JIS K 3838 : 1995	SDS—ポリアクリルアミドゲル電気泳動分析通則(解説収録) ……………	1892
JIS Z 8710 : 1993	温度測定方法通則(抜粋) ……………	1907
JIS Z 8815 : 1994	ふるい分け試験方法通則(解説収録) ……………ISO 2591-1 : 1988(MOD) ……	1923
JIS Z 9080 : 2004	官能評価分析—方法 ……………ISO 4120 : 1983, 4121 : 1987, 5495 : 1983, 6658 : 1985, 8587 : 1988(MOD) ……	1935

水

JIS K 0557 : 1998	用水・排水の試験に用いる水 ……………	1979
JIS K 0558 : 2002	超純水中のほう素試験方法 ……………	1983
JIS K 0550 : 1994	超純水中の細菌数試験方法 ……………	1986
JIS K 0551 : 1994	超純水中の有機体炭素(TOC)試験方法 ……………	1994
JIS K 0552 : 1994	超純水の電気伝導率試験方法 ……………	2000
JIS K 0553 : 2002	超純水中の金属元素試験方法 ……………	2003
JIS K 0554 : 1995	超純水中の微粒子測定方法 ……………	2032
JIS K 0555 : 1995	超純水中のシリカ試験方法 ……………	2040
JIS K 0555 : 2009	(追補1) ……………	2045
JIS K 0556 : 1995	超純水中の陰イオン試験方法 ……………	2046

試験・測定方法

◇ JIS K 0061 : 2001	化学製品の密度及び比重測定方法 ……………	2057
JIS K 0062 : 1992	化学製品の屈折率測定方法 ……………	2087
JIS K 0063 : 1992	化学製品の旋光度測定方法 ……………	2092
JIS K 0064 : 1992	化学製品の融点及び溶融範囲測定方法 ……………	2097
JIS K 0065 : 1992	化学製品の凝固点測定方法 ……………	2101
JIS K 0066 : 1992	化学製品の蒸留試験方法 ……………ISO 918 : 1983 (IDT) ……	2103
JIS K 0067 : 1992	化学製品の減量及び残分試験方法 ……………	2111
JIS K 0068 : 2001	化学製品の水分測定方法 ……………	2118
JIS K 0069 : 1992	化学製品のふるい分け試験方法 ……………	2134
JIS K 0070 : 1992	化学製品の酸価, けん化価, エステル価, よう素価, 水酸基価及び不けん化物の試験方法 ……………	2139
JIS K 0071-1 : 2017	化学製品の色試験方法—第1部: ハーゼン単位色数(白金—コバルトスケール) ……………ISO 2211 : 1973, 6271 : 2015(MOD) ……	2147
JIS K 0071-2 : 1998	化学製品の色試験方法—第2部: ガードナー色数 …………… ……………ISO/DIS 4630.2 : 1996(MOD) ……	2158
JIS K 0071-3 : 1998	化学製品の色試験方法—第3部: セーボルト色数 ……………	2162
JIS K 0071-4 : 1998	化学製品の色試験方法—第4部: ASTM色数 ……………	2168
JIS K 0072 : 1998	化学製品の硫酸着色試験方法 ……………	2171

JIS Z 8462-2:2003	測定方法の検出能力—第2部：検量線が直線である場合の方法……………	……………ISO 11843-2:2000(IDT)…	2176
JIS Z 8462-5:2011	測定方法の検出能力—第5部：検量線が線形及び非線形である場合の方法……………	……………ISO 11843-5:2008(IDT)…	2191
JIS Z 8462-6:2018	測定方法の検出能力—第6部：測定値がポアソン分布に従う場合の限界値及び検出可能な最小値を正規分布近似によって求める方法……………	……………ISO 11843-6:2013(IDT)…	2201
JIS Z 8462-7:2018	測定方法の検出能力—第7部：分析機器ノイズの確率論的性質に基づく方法……………	……………ISO 11843-7:2012(IDT)…	2219
JIS Z 8703:1983	試験場所の標準状態(解説抜粋)……………	……………ISO 554:1976, IEC 60160:1963(MOD)…	2237
JIS Z 8704:1993	温度測定方法—電気的方法……………		2240
JIS Z 8705:1992	ガラス製温度計による温度測定方法……………		2255
JIS Z 8705:2006	(追補1)……………		2261
JIS Z 8802:2011	pH測定方法……………		2262
JIS Z 8806:2001	湿度—測定方法……………		2268

データの取扱い

JIS Z 8401:2019	数値の丸め方……………		2297
JIS Z 8402-1:1999	測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)—第1部：一般的な原理及び定義……………	……………ISO 5725-1:1994(IDT)…	2299
JIS Z 8402-2:1999	測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)—第2部：標準測定方法の併行精度及び再現精度を求めるための基本的……………	……………ISO 5725-2:1994(IDT)…	2313
JIS Z 8402-6:1999	測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)—第6部：精確さに関する値の実用的な使い方……………	……………ISO 5725-6:1994(IDT)…	2346
JIS Z 9041-1:1999	データの統計的な解釈方法—第1部：データの統計的記述……………		2379

参 考

原子量表……………	2407
JISの“まえがき”の省略……………	2409
ISO, IECが発行する規格・出版物の著作権……………	2410